













Приложение №2 к учебному плану

Шифр направления:  
 Направление:  
 Образовательная программа:  
 Уровень: Магистр  
 Нормативный срок освоения ООП: 2 года  
 Форма обучения: Очная  
 Стандарт ВО: СУОС

12.04.01  
 Приборостроение  
**Приборы и методы контроля качества и диагностики**  
 Условия освоения ООП: Полный срок  
 Технология освоения ООП: Традиционная  
 Фактический срок освоения ООП: 2 года

Одна зачетная единица: 36ч.

N п/п	Индекс	Наименование дисциплин	Объем работы в часах и виды учебной нагрузки											Номер модуля/дисциплины	
			Всего часов	В т.ч. контактная работа	Аудиторная				Контактная			Самостоятельная работа	В т.ч. контактная работа по самост. работе		В т.ч. контактная работа по промежуточной аттестации
					Всего часов	Лекции	Прак. занятия	Лаб. занятия	Контактная работа по лекции	Контактная работа по прак.	Контактная работа по лаб. занятиям				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Общая трудоемкость основной образовательной программы	4320	812.43	972	288	126	558	216	126	216	3348	83.70	15.73	
	Б1	Дисциплины (модули)	2484	657.43	972	288	126	558	216.00	126.00	216.00	1512	83.70	15.73	
1	Б1.Б	Обязательная часть	1728	657.43					216.00	126.00	216.00		83.70	15.73	
2	М.1.1	История и методология науки и техники	108	41.65	36	36	0	0	36.00			72	5.40	0.25	1142546
3	1.1.1	История и методология науки и техники	108	41.65	36	36	0	0	36.00			72	5.40	0.25	1142547
4	М.1.2	Аналоговые и микропроцессорные устройства электронных приборов	288	128.86	108	36	0	72	36.00		72.00	180	16.20	4.66	1159344
5	1.2.1	Микропроцессорные системы в науке и производстве	144	64.43	54	18	0	36	18.00		36.00	90	8.10	2.33	
6	1.2.2	Проектирование аналоговых электронных устройств	144	64.43	54	18	0	36	18.00		36.00	90	8.10	2.33	
7	М.1.3	Интеллектуальные материалы и цифровые устройства	252	104.00	90	18	0	72	18.00		72.00	162	13.50	0.50	1165226
8	1.3.1	Методы искусственного интеллекта в материаловедении	144	62.35	54	18	0	36	18.00		36.00	90	8.10	0.25	
9	1.3.2	Проектирование импульсных и цифровых устройств	108	41.65	36	0	0	36			36.00	72	5.40	0.25	
10	М.1.5	Проектная деятельность	432	4.66	0	0	0	0				432		4.66	1158474
11	1.5.1	Проектный практикум 1	216	2.33	0	0	0	0				216		2.33	1158465
12	1.5.2	Проектный практикум 2	216	2.33	0	0	0	0				216		2.33	1158462
13	М.1.6	Поисковый анализ международных научных публикаций	144	85.38	72	0	72	0		72.00		72	10.80	2.58	1160338
14	1.6.1	Поисковый анализ международных научных публикаций	144	85.38	72	0	72	0		72.00		72	10.80	2.58	
15	М.1.7	Управление интеллектуальной собственностью	108	41.65	36	18	18	0	18.00	18.00		72	5.40	0.25	1142549
16	1.7.1	Управление интеллектуальной собственностью	108	41.65	36	18	18	0	18.00	18.00		72	5.40	0.25	1142548
17	М.1.4	Методы неразрушающего контроля и диагностики	396	251.23	216	108	36	72	108.00	36.00	72.00	180	32.40	2.83	1160339



18	1.4.1	Актуальные проблемы неразрушающего контроля и диагностики	144	85.13	72	36	36	0	36.00	36.00		72	10.80	2.33	
19	1.4.2	Акустический контроль и диагностика	144	83.05	72	36	0	36	36.00		36.00	72	10.80	0.25	
20	1.4.3	Вихретоковый контроль и диагностика	108	83.05	72	36	0	36	36.00		36.00	36	10.80	0.25	
21	Б1.В	Формируемая участниками образовательных отношений	756												
22	Б1.В.ВВ	По выбору студента	756		414	72	0	342				342			
23	М.1.8	Методы научных исследований в неразрушающем контроле	432	249.15	216	0	0	216			216.00	216	32.40	0.75	1160341
24	1.8.1	Учебно-исследовательская деятельность в приборостроении	432	249.15	216	0	0	216			216.00	216	32.40	0.75	
25	М.1.9	Методы научных исследований в электронике	432	249.15	216	0	0	216			216.00	216	32.40	0.75	1160340
26	1.9.1	Исследование материалов микро- и нанoeлектроники	432	249.15	216	0	0	216			216.00	216	32.40	0.75	
27	М.1.10	Методы получения и свойства наноматериалов	324	211.91	180	54	18	108	54.00	18.00	108.00	144	27.00	4.91	1142585
28	1.10.1	Радиационные технологии создания наноразмерных структур	108	64.43	54	18	18	18	18.00	18.00	18.00	54	8.10	2.33	1132892
29	1.10.2	Спецпрактикум "Методы получения и исследования свойств наноразмерных материалов"	108	62.35	54	0	0	54			54.00	54	8.10	0.25	1132893
30	1.10.3	Функциональные материалы микро- и нанoeлектроники	108	85.13	72	36	0	36	36.00		36.00	36	10.80	2.33	1132887
31	М.1.11	Технологии неразрушающего контроля и диагностики	324	232.61	198	72	0	126	72.00		126.00	126	29.70	4.91	1142587
32	1.11.1	Радиационный контроль и диагностика	108	85.13	72	36	0	36	36.00		36.00	36	10.80	2.33	
33	1.11.2	Спецпрактикум "Физические основы контроля и диагностики материалов и изделий"	108	62.35	54	0	0	54			54.00	54	8.10	0.25	
34	1.11.3	Электрический и магнитный контроль	108	85.13	72	36	0	36	36.00		36.00	36	10.80	2.33	
	Б2	Практика	1620	122.00	0	0	0	0				1620			
35	Б2.Б	Обязательная часть	1620	122.00											
36	М.2.1	Учебная практика, производственно-технологическая	216	96.00	0	0	0	0				216			1147340
37	2.1.1	Учебная практика, производственно-технологическая	216	96.00	0	0	0	0				216			
38	М.2.2	Производственная практика, научно-исследовательская работа	540	10.00	0	0	0	0				540			1160342
39	2.2.1	Производственная практика, научно-исследовательская работа	540	10.00	0	0	0	0				540			
40	М.2.3	Производственная практика, преддипломная	864	16.00	0	0	0	0				864			1147342
41	2.3.1	Производственная практика, преддипломная	864	16.00	0	0	0	0				864			
	Б3	Государственная итоговая аттестация	216	33.00	0	0	0	0				216			
42	Б3.Б	Обязательная часть	216	33.00											
43	М.3.1	Государственная итоговая аттестация	216	33.00	0	0	0	0				216			1159841
44	3.1.1	Подготовка к защите и процедура защиты выпускной квалификационной работы	216	33.00	0	0	0	0				216			
	Б4	Факультативы	216	50.10	44	12	32	0	11.88	31.68		172	6.54		
45	Б4.В	Формируемая участниками образовательных отношений	216	50.10					11.88	31.68			6.54		
46	М.4.1	Адаптационный модуль для лиц с ограниченными возможностями здоровья	216	50.10	44	12	32	0	11.88	31.68		172	6.54		1156238
47	4.1.1	Основы личностного роста	108	25.05	22	6	16	0	5.94	15.84		86	3.27		
48	4.1.2	Развитие ресурсов организма	108	25.05	22	6	16	0	5.94	15.84		86	3.27		